

# nanoVTEP Test probe OTC-KS-NV-GKS

产品 111606



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 开路测试用组件,用于半导体芯片的电容式测试,检测其是否断裂、短路和存在焊接缺陷
- 适用于软件版本为 9.2 或更高的所有 Keysight 307x 测试系统
- 与 VTEP 技术相比,重复精度、测试覆盖率和故障检测能力均有提高

## 使用

nanoVTEP 探针用于集成电路的电容测试,可检查集成电路内部的接线接口是否存在断裂、短路和缺陷焊接。

nanoVTEP 探针是 Keysight 最新推出的无矢量 Opens 测试解决方案,取代之前的 VTEP 探针。除了重复精度、测试覆盖范围和故障检测能力大幅提高之外,新型 nanoVTEP 探针还能对微弱信号进行高达 40% 的放大,因为放大器位置靠近传感器板。

新型 nanoVTEP 只能与 nanoVTEP MUX 电路板配合使用。nanoVTEP 和 VTEP 探针可在一个测试治具中同时使用。



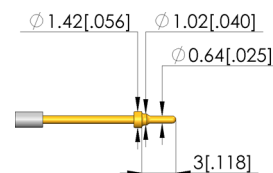
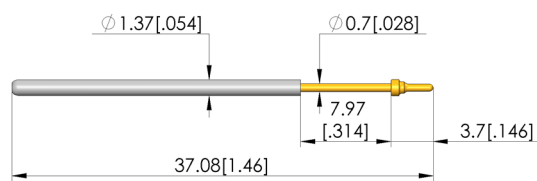
1:1

## 提示:

NanoVTEP 探针可在软件版本为 9.2 或更高的所有 Keysight 307x 测试系统上安全使用。如果您所使用的软件版本早于 9.2, 请直接联系测试系统制造商 Keysight。

## 提示:

要正确扩展 Keysight nanoVTEP 探针, 请使用扩展图 INFO 4250。



## 一般数据

产品组:

结构系列:

类型:

规格:

配件类型:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

开路测试

OTC

Keysight 无矢量测试

nanoVTEP 弹簧探针 (QA)

扩展配件

10 °C

60 °C

是

## 适用于

真空测试治具 (VA):

替换套件 (WS):

VA 2070S/L

# nanoVTEP Test probe OTC-KS-NV-GKS

产品 111606



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



## Accessories

Part no.	Designation	Version
108707	OTC-KS-NV-EP	nanoVTEP amplifier
108704	OTC-KS-NV-SP-031-031	nanoVTEP sensor plate 1.2 inches
108705	OTC-KS-NV-SP-065-065	nanoVTEP sensor plate 2.5 inches
108706	OTC-KS-NV-SP-155-013	nanoVTEP sensor plate 152 mm x 12.5 mm
108710	OTE-KS-NV-064-MUX	nanoVTEP signal conditioner board
108711	OTE-KS-NV-064-MUX-REF	nanoVTEP signal conditioner board ConnectCheck

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室。+49 7531 8105-0  
客户热线。+49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。04/26\_CN